



7^{ème} Ecole « Analyse Structurale par Diffraction des Rayons X et Contributions de la Diffusion Totale à la Détermination Structurale »

3 - 7 Juillet 2017, Abbaye des Prémontrés (Pont à Mousson)

<http://www.crystallography.fr/lab/fr/education/congres/nancy2017/>

Objectifs de l'école :

- Donner les bases nécessaires à la détermination de structures cristallines par diffraction des rayons X
- Acquérir des connaissances sur les méthodes de détermination et d'analyse de structures cristallines

Thèmes abordés :

- Cristallographie : Concepts fondamentaux et utilisation d'éléments de symétrie
- Diffraction des rayons X : Description et mesures
- Résolution et affinement de structures cristallines
- Analyse structurale
- Construction de modèles structuraux dans des transitions de phase
- Affinement multipolaire et transférabilité de paramètres décrivant la distribution électronique des atomes
- Contributions de la Diffusion Totale à la détermination structurale
- Ateliers pratiques : utilisation de logiciels cristallographiques

Public concerné :

Chercheurs, Enseignant-Chercheurs, Ingénieurs, Post-docs, Etudiants en thèse

Intervenants extérieurs :

Pr. Carmelo Giacovazzo (Institute of Crystallography , Italy)
Pr. Richard Copper (University of Oxford, UK)
Pr. Reinhard Neder (Friedrich-Alexander Universitat Erlangen-Nürnberg, Germany)
Dr. Pierre Fertey (Synchrotron SOLEIL, France)
Dr. Eric Hovestreydt (à confirmer) (Bruker AXS, Netherlands)

Intervenants du laboratoire CRM2 :

Pr. Massimo Nespolo (Université de Lorraine, France)
Dr. Emmanuel Aubert (Université de Lorraine, France)
Dr. Benoit Guillot (Université de Lorraine, France)
Dr. Christian Jelsch (Université de Lorraine, France)
Dr. Nicolas Claiser (Université de Lorraine, France)
Dr. Emmanuel Wenger (Université de Lorraine, France)